

ACCU-Prober

高頻訊號損失測試設備

因應訊號傳遞頻率越來越高，量測電路板訊號損失越顯得重要。為了因應量產測試，Intel發表SET2DIL測試方法，在使用TDR與單端線路量測的方法下得到差分線路的插入損失。IBM開發SPP方法，同樣利用TDR來量測線路的傳遞損失，並且可以運用在單端線路或者是差分線路上的量測。



特色

ACCU-Prober 是一個開放式的平台

提供量產測試完整的解決方案。

可供升級選配功能的平台

ACCU-Prober是一個平台，不僅僅只是單一產品，可以提供如EBW、SET2DIL與SPP等等的測試功能。不需要一次建置完成，可以依照測試需求選配或升級來得到需要的測試功能。

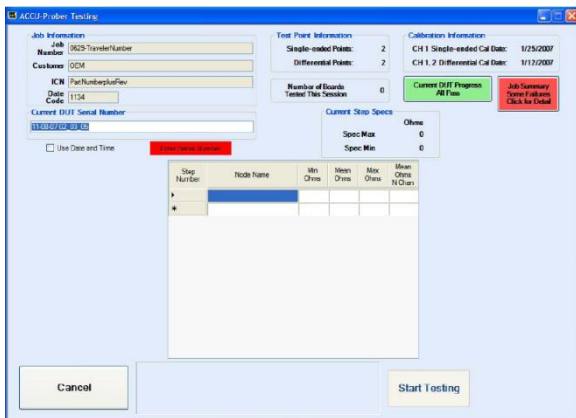


貼近量產測試需求

ACCU-Prober了解測試員的需求，提供快速的量測結果、直覺式的操作介面、方便量測的腳踏開關以及手持式的測試握把。ACCU-Prober提供靜電防護裝置來保護Tektronix的TDR，避免損壞昂貴的測試模組。

來自高頻測試的先驅者

Introbotix 與 SET2DIL 與 SPP 的開發者 Intel 與 IBM 有著長年的合作關係，同時也是 Intel 與 IBM 認證的設備製造商。ACCU-Prober 就是在合作開發下的產物。



introbotix authorized reseller



測試能力與規格



1 ACCU-Prober Standard

ACCU-Prober Standard

規格	
測試能力	單端、差分阻抗測試，傳遞延遲、速率，有效Er，EBW（所有測試能力皆符合IPC TM650 2.5.5.7&12）
測試探針	TDR阻抗探針(*2)、36''可撓高頻同軸電纜(*2)、4''高頻同軸電纜(*2)
測試軟體	ACCU-Prober System 自動測試排程 自動校正程序(需要Airline) 自動報告產生器 TDR波型擷取
靜電隔離器 ACCU-Prober SIU (Static Isolation Unit)	隔離靜電保護TDR模組 兩、四通道連接埠 18''高頻同軸電纜(*2 or 4) 腳踏開關

ACCU-Prober 提供彈性的組合，可以依使用者的需求來選配需要的功能。

2 ACCU-Prober With SET2DIL

ACCU-Prober Standard

+

SET2DIL Software

SET2DIL Probe

SET2DIL	
測試能力	SET2DIL測試(Sdd21差分插入損失)
測試探針	手持式SET2DIL測試探針(*1)
測試軟體	即時測試結果顯示 自動校正程序(Thru、deslew) 自動量測結果報告產生 波型讀取顯示

3 ACCU-Prober With Full Capability

ACCU-Prober Standard

+

SPP and SET2DIL Software

SPP and SET2DIL Probe

SPP	
測試能力	單端/差分SPP測試 (符合IPC TM650 2.5.5.12)
測試探針	手持式SPP測試探針(*1 or 2) SPP SMA接頭探針(*1 or 2) 脈衝產生電路-IFN (*1 or 2) 高頻同軸電纜轉接頭3.5 mm M to M(*1 or 2) #數量與單端/雙端SPP測試有關
測試軟體	自動待測物評估 自動SPP脈衝擷取與快速傅立葉轉換 自動測試結果繪圖 α 、 β 自動量測報告產生 波型檔案建立與儲存